

# 真空型多功能荧光光谱仪(RoHS/镀层/合金成分分析仪) 型号XRF-VF300-Y

真空系统  
手动变焦

- 用于RoHS检测, 电镀镀层/电泳漆厚度分析, 合金成分分析
- 应用领域: 接插件等电子元器件检测, 紧固件行业, 汽车零部件, 陶瓷金属化行业, 五金行业(家用设备及配件等, 如Cr/Ni/CuZn(ABS)), 新能源行业(光伏焊带丝等), 环保行业, 电镀液的金属阳离子检测等
- 搭载微聚焦X射线发生器和先进的光路转换聚焦系统, 最小测量面积达0.2mm<sup>2</sup>
- 拥有无损手动变焦检测技术, 可对0-30mm各种异形凹槽件进行无损检测
- 装配SDD硅漂移探测器, 分辨率更高, 能量线性好, 更高的峰背比, 配有微光聚集技术, 最近测距光斑扩散度小于10%
- 核心EFP算法, 可同时分析23个镀层, 24种元素, 可对多层多元素, 包括同种元素在不同层都可快, 准, 稳的做出数据分析
- 配置智能抽真空系统, 屏蔽大气对低能量元素的影响, 对Al, Si, P等轻元素涂镀层厚度以及成分分析精度更高, 数据更加准确稳定
- 标配4种准直器, 满足多种测试需求
- 人性化封闭软件, 自动判断故障, 提示校正及操作步骤, 避免误操作



## 技术参数

RoHS分析	有害元素分析	Cd, Pb, Hg, Br, Cr, Cl, As, Sb
	检出限	2ppm
	含量分析范围	2ppm-99%
镀层分析	元素范围	锂Li(3)-铀U(92)
	检出限	0.005μm
	分析厚度	0.01-80μm
合金成分分析	元素范围	钠Na(11)-铀U(92)
	检出限	2ppm
	含量范围	2ppm-99%
EFP算法	标配	
分析时间	1-200s	
探测器	SDD硅漂移探测器	
X射线装置	微聚焦加强型射线管	
准直器	Ø0.5mm, Ø1.5mm, Ø3mm, Ø8mm四种准直器自动切换	
最近测距光斑扩散度	<10%	
样品观测	1/2.7" 彩色CCD, 变焦功能	
测量距离	变焦0-30mm	
对焦方式	高敏感镜头, 手动对焦	
真空系统	智能抽真空系统	
样品腔高度	100mm	
工作环境	15-30°C, <70%RH	
电源	AC220V, 50Hz, 95W	
尺寸	470×550×370mm	
重量	50kg	

## 标准配置

主机	1个
电脑	1套
软件	1套
打印机	1个
真空泵	1个
附件箱	1个
12元素片	1套
Ag标准片	1片
Ni标准片	1片
ERM-EC681m标准片	1个

## 可选配置

电镀液测量杯	XRF-PT230-MC
溶液测试膜	XRF-PT230-SF
Au标准片	MSS-P01
Cr标准片	MSS-P02
Cu标准片	MSS-P03
Zn标准片	MSS-P04